

增刊

多粒子模拟方法分析北京正负电子对撞机储存环束团长度拉伸效应

李云,王光伟

清华大学工程物理系 北京 100084

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 采用多粒子模拟方法,分析了北京正负电子对撞机(BEPC)储存环纵向不稳定性,给出了BEPC储存环束团长  
度与单束流强的关系,得出了阈值流强.模拟结果与BEPC95年4月实测结果符合较好.

关键词 [储存环纵向不稳定性](#) [束团拉长](#) [阈值流强](#) [阻抗](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

李云

作者个人主页: [李云](#); [王光伟](#)

#### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDE\(169KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“储存环纵向不稳定性”的 相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

· [李云](#)

· [王光伟](#)